



基質輔助雷射脫附游離飛行式質譜儀

型號：Bruker Ultraflex TOF/TOF

主要元件：離子源、氮氣雷射 337 nm、飛行管質量分析器、偵測器

應用：樣品與基質之混合物點置於金屬樣品盤表面上，待其乾燥形成固體結晶後，於質譜儀之離子源中施以雷射脈衝，基質會將所吸收的雷射能量轉移給樣品分子，使之離子化並游離為氣相狀態。接著透過飛行管質量分析器測量不同胜肽抵達偵測器之飛行時間而計算出胜肽之質荷比(m/z)，並記錄成質荷比之圖譜。最後將所測得之胜肽質荷比圖譜，與蛋白質序列資料庫進行數據比對，搜尋符合的蛋白質，達到鑑定蛋白質的目的